(料)

給

木

記

λ

協

力 是

I IE

記 清

入

鈴

認 木

処 場

三友電子工業個小宅課長様

%行日:2012年 1月20日

不具合管理No. 43F-1-0na

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:2012年1月26日

in 調 杳 18 12.1.24 映次

番 503186-2029 SX 名 MICRO SD CARD CONN SWICH ロットNo 11.12.02.A.Z.081 2012年1月20日 発生日 不良数量 8,000個

内容 めっき厚薄い めっき厚:規格値0.03MIN 実測値:001~0.02 101



当

1. **確認内容** モレックス様大連工場より、めっきロットSU071211-052K1-009の巻き芯側のAuめっき厚が規格 より薄くなっているとのご指摘をいただきました。

生産変化点は治具洗い後の生産始めのリールであること、他条で治具洗いの時間帯に重なっていた ことがあります。生産記録には、画像処理装置の反応履歴は2箇所ありました。(始めより1,270ピン 目と6,000ピン目) 6,000ピン目付近は変形除去をし継ぎ目1箇所作成した履歴が有りました。 保管サンプルのAuめっき厚は、前後リールを含め、0.04~0.05/miあり、規格を満たしておりました (別紙1)

返却品の処置 (数量明記)

返却品はございません。 (3,221pcsの波及完成品は廃棄処分 とのご連絡をいただいております。)

2. 発生原因

21/3,221

本製品の生産が始まると同時に、他条で治具洗いの作業が始 まり、何らかの振動で製品がAuフラッシュめっき治具より浮 き上がりを起こし、局所的なAu薄めっきとなりました。(Au めっき厚規格0.03µm以上に対し、0.01~0.02µm) 画像装置は2箇所の反応履歴が有りましたが、オンラインの 確認では2箇所の内1個所(1,270ピン目)での変形はなく消し 4 流出原因

処 濁

画像反応の有った2箇所の内、6,000ピン目は再検で変形を 除去致しましたが、1,270℃7目は画像装置のオンライン 確認で変形なしと消し込みがなされていたので、再検を行 いませんでした。

めっき厚の検査においても規格を満たしており合格と 致しました。

不良率

3. 発生防止対策

込みがされておりました。

Auフラッシュめっき治具からの浮き上がり防止策と して案内ローラーをAuめっき工程に設置致します。

5. 流出防止対策

本製品はAuフラッシュ部の規格が厳しいため、画像 反応があった部分は、明らかな変形以外は薄めっき の観点で全検することとし、鍍金作業標準カードの 注意事項に追記いたします。

実施日: ++ 2012年 1 月 26 日

実施日:++2012年 1 月 26 日 在庫品仕掛品の確認 在庫品 仕掛品 なし なし (有)· 無 標準類改訂 (鍍金作業標準カード 对第後、12.03.15.A.F.0001-0020~12.03,26.A.G.0047-0076 の計らかりにおいて同で具合無しの為、有効性ありと判断致します。

回答日: 42012年 1 月23 日 認 作 成 承 四官 品管 副工場長 12 1.23 72 1. 2 12.1.23 小宅 星野 派 部 確認者 調

黒岩 黒岩 12.4.13 12.4.13 映次 映次

的清 12.4.13

Pew Accordate 10010 :

